リッツ線の分割構造に着目した損失解析 朝雛 えみり*, 上田 祐資*, 永井 歩美**, 石飛 学*

(奈良高専*, 東北大学**) High-Frequency Loss and split structure of Litz Wire E.Asahina, A.Nagai, Y.Ueda, M.Ishitobi (National Institute of Technology, Nara College Tohoku University)

<u>はじめに</u>

リッツ線は、銅損を抑制する構造をもつため、非接触給電や誘導加熱といった高周波コイル用巻線として 汎用されている。一方で、素線径によって単線以上の発熱も確認されており⁽¹⁾、適切な素線径の選択が重 要である。そこで、本研究ではシンプルな構造の損失解析モデルを提案し、発熱の原因である誘導電流 と素線構造の関係について、分析を試みている。

<u>リッツ線における損失</u>

Fig.1 に提案する損失解析モデルを示す。リッツ線の断面が点 対称であることから、半径方向と円周方向の分割数および絶縁 被膜の厚さと材質をパラメータに設定し、モデリングを行って いる。

Fig.2 に円周方向の分割に対する解析モデルと損失特性を示す。 ここで,内径 1.1[mm],外径 1.2[mm],導体間距離を 5[μm]とし, 内径外径分割数を 1~12に可変させている。また入力電流を 2[A], 1[MHz]とし,電磁場解析にはムラタソフトウェア製の Femtet[®] を用いている。Fig.2(b)から損失は円周方向の分割数に依存しな いことがわかる。

Fig.3 に半径方向の分割に対する解析モデルと損失特性を, Fig.4 に分割数 4, 9, 17 の電流密度分布を示す。解析条件は, 円 周方向の分割数に対する解析と同様である。ただし、分割数を 1~30に可変しつつ, 導体の最大半径を1.2[mm] に統一するため, 分割数の変化に伴って導体厚さを増減させている。Fig.3 から分 割数9のとき、損失のピークが確認できる。このとき、導体の 厚さは 1[MHz]における表皮深さ δ (0.066[mm]) の 2 倍程度とな っている。一方で Fig.4 より, 順方向と逆方向の交互に流れる誘 導電流が確認できる。この交互の電流は、素線を流れる平均電 流に対して無視できない大きさをもち、発生回数が分割数とと もに増加している。また、交互電流の振幅は分割数が多いほど 減少傾向を示している。特に分割数が17以上(導体の厚さδ以 下)のとき、逆方向電流の消失が確認できる。これは、導体が 薄くなるほど正負の交互電流が干渉し、振幅を抑制できたと考 えられる。したがって、素線径の小さいリッツ線ほど銅損が抑 制され、特にδ以下であると効果が高い。

参考文献

(1) 水野勉, 他: 日本 AEM 学会誌, Vol.18, No.3, pp.300-305 (2010)



Fig. 1 Analysis model of litz wire



(a)Analysis model (b)Loss characteristics Fig. 2 Analysis of circumferential direction



(a)Analysis model (b)Loss characteristics Fig. 3 Analysis of radial direction



Distance from the center [mm] Fig. 4 Current density distribution on each thickness